(19)日本国特許庁 (JP)

## (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出職公開發号

## 特開平11-126952

(43)公開日 平成11年(1999)5月11日

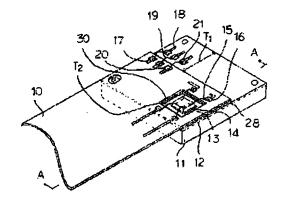
(51) Int.CL6	鐵別記号	ΡI			
H05K 1/14		H05K	1/14	1	
HO1L 21/60	301	H01L 21	1/60	301	A
H 0 5 K 3/38		H05K 3	3/36 Z		
		容在請求	未館求	菌泉項の数4	OL (全 6 頁)
(21)出顯番号	<b>特顯平9-289875</b>	(71)出庭人		189 養株式会社	
(22)出顧日	平成9年(1997)10月22日		大阪府	<b>计口的京阪</b> 本通	2丁目5巻5号
		(72) 発明者	五十嵐	優助	
				中国市京阪本通: 中式会社内	2丁目5番5号 三
		(72)発明者	酒井 #	尼泰	
				守口市京阪本通: 朱式会社内	2丁目5番5号 三
		(72) 発明者			2丁目5番5号 三
			洋电機	朱式会社内	
		(74)代理人	<b>非理</b> 土	安官 耕二	(外1名)
					最終頁に続く

#### (54) 【発明の名称】 記成集積回路装置およびその製造方法

#### (57)【要約】

【課題】 基板にフレキシブルシートが貼り付けられ、決まった回路が実現されているが、耐食性が考慮され、Auのパッド、Au細線が使用されコストがかかる問題があった。またAuのボンディングは、熱圧者で実現されるため、フレキシブルシート下の接着剤が軟化し、ボンディング性が悪化する問題があった。

【解決手段】 まずAIの細線は、常温でボンディング可能であり、しかもNIに接続可能であることから、フレキシブルシート10のバッド20には、Cu.NIを満暑し、ここにAI線をワイヤーボンドする。



#### 【特許請求の範囲】

【語求項 1 】 少なくとも絶縁処理された表面に導電パターンが設けられた復成集積回路基板と、

表面に導電パターンが設けられ、前記規成集積回路基板 に接着剤を介して貼り合わされたフレキシブルシート と

前記フレキシブルシートとの非重量部に対応する前記復 成集積回路基板に設けられたCuの第1の電極と

前記フレキシブルシートに設けられたCuの第2の電極 と

前記第1の電極と前記第2の電極とを電気的に接続する 金属細線とを有する視成集積回路装置に於いて

前記金属細線の接続部に対応する前記第1の電極および 第2の電極には、Niが被覆され、この被覆されたNi とAlより成る前記金属細線がワイヤボンディングで接続される事を特徴とした混成集績回路装置。

【請求項2】 前記金属細線の接続部に対応する前記第 1の電極の表面にはAuが接覆されている請求項1記載 の提成集積回路装置。

【請求項3】 基板と、

表面に導電パターンが設けられ、前記規成集積回路基板 に接着剤を介して貼り合わされたフレキシブルシート と

前記フレキシブルシート上または前記フレキシブルシートの開口部に対応する前記墓板に設けられた半導体チップの第1の電極と、

前記フレキシブルシートに設けられたCuの第2の電極

前記第1の電極と前記第2の電極とを電気的に接続する 金座組織とを有する複成集積回路装置に於いて、

前記金属細線の接続部に対応する第2の電極には、Ni が接覆され、この被覆されたNiとAlより成る前記金 属細線がワイヤボンディングで接続される事を特徴とし た混成集補回路鉄置。

【請求項4】 少なくとも絶縁処理された復成集積回路 基板の豪面に遵電パターンを設け、

表面に導電パターンが設けられたフレキシブルシート を、前記復成集積回路基板に接着剤を介して貼り合わせ、

前記プレキシブルシートとの非重量部に対応する前記復 40 成集積回路基板に設けられたCuの第1の電極と、前記 フレキシブルシートに設けられたCuの第2の電極とを 金属細線で接続する復成集積回路装置の製造方法に於い

前記プレキシブルシート上で前記第2の電極の近傍には、Cuの第3の電極が設けられており、

前記第2の電極と前記第3の電極を含む領域は、網箔で 形成され、この上にN」が被覆された後、前記網路と前 記Niがパターニングされる草を特徴とした復成集論回 路鉄圏の製造方法。 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は混成集積回路装置に 関し、少なくとも衰面が絶縁処理され、配線や素子が実 装された混成集積回路基板、または単なる支持基板とし て基板を用い、この上にプレキシブルシートを貼り合わ せた装置に関するものである。

2

[0002]

【従来の技術】一般に、提成集績回路鉄置の集積度が考慮され、多層構造が採用された複成集積回路装置がある。これは、例えば特関平り4-273151号、特関平04-87358号等に詳しく説明されている。【0003】特に後者の公報は、Cuパターンが形成された陽極酸化処理のA!基板にフレキシブルシートを貼り合わしたもので、基板の一部に貼り合わされている。一方、図7は、機器との装着性が考慮され、フレキシブルシート10が採用されたもので、図に於いて上が平面図、下がA-A線に対応する断面図が一体で説明されているものである。

20 【① 0 0 4】図番11は、少なくとも表面が絶縁処理された混成集補回路基板で、ここでは金属基板を採用しているため、表面に絶縁樹脂12が被着され、この上にCuバターンが形成されている。このCuバターンは、例えばICチップ13が搭載されるランド14、ICチップが金属細線15を介して接続されるボンディングバッド16、フレキンブルシート10の配線17と混成集績回路基板11の配線18とを金属細線19を介して接続するためのバッド20、21と、機器へ延在される配線22、配線23との交差を適けるため形成されたアイランド24等で成っている。

【① 0 0 5 】そして複成集積回路基板の上に蓋をかぶせるような形状の手段、一般にはケース村と呼ばれているものを採用して封止している。この構造は、中空構造やこの中に別途樹脂が注入されているものである。また、半導体 | Cのモールド方法として有名なトランスファーモールド、 | C チップ | 2 や金属細線の部分に樹脂を塗布するボッティング法等で封止されている。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】ここでパッド16、2 9 0.21、アイランド24等は、耐雰囲気が考慮され て、Auメッキ25が施されている。しかし、パッドの 一番下の層は、Cu26でなるため、その柔らかさから 下地として硬質なNuメッキ27が能されている。しか し以下の問題があった。

【0007】 **OA** u メッキ25は材料として非常に高価であり、コストの上昇をきたす。

の下地としてNiメッキ2?が必要である。

❷A uのエッチャントは王水であり、全面メッキの後に パターニングしようとしても、選択エッチングができ

50 ず、バターニングされたパッドの上に電解メッキ、また

は無電解メッキでしか被覆できない。

【0008】前者の電解メッキでは、バッド16、2 0.21、アイランド24に電流を流すための引き回し 譲が、必要となり、実装密度の妨げとなる。後者の無電 解メッキでは、パッド16、20、21、アイランド2 4 令配線の間隔が100μm以下のファインパターンに なると、ショートの原因となる。例えば、パッド21、 21 21間にAuが生成し、短絡してしまう。

【①①①9】また無電解Niメッキのみでパターン上に ボンディングポストを形成しようとすると、無電解溶液 10 電極が形成されている。 に不純物としてリン等が混入されており、この不純物が 析出することによりボンダビィリティが悪化する問題が あった。

のAuの細線を使ってワイヤーボンディングすると、方 法は、超音波、熱圧者接合であるため、基板温度が最低 でも150~170度程度必要となる。この温度のため フレキシブルシート10や下層の接着剤28が軟らかく なり、ボンダビリティが悪化する。特にファインパター ンとなり、ポンディング数が数多くなれば成る程。この 問題は顕著となる。

#### [0010]

【課題を解決するための手段】本発明は上記課題に鑑み 成されたもので、第1に、金属細線の接続部に対応する 複成集績回路基板側の第1の電極およびフレキシブルシ ート側の第2の電極に、Niを被覆し、この被覆された NiとA!より成る前記金属細線とをワイヤボンディン グで接続することで解決するものである。

【①①11】第2に、前記金属細線の接続部に対応する 前記第1の電極の表面にAuを被覆することで解決する の電極に、Niを皱覆し、この波覆されたNiとAlよ り成る前記金属細線とをワイヤボンディングで接続する ことで解決するものである。

【①①12】A1ワイヤーは、室温・超音波でポンディ ングされ、Niともボンディングできるため、Au細線 - A u 被膜を省略でき、基板を加熱する必要もない。第 4に、フレキシブルシート上で前記第2の電極の近傍の Cuの第3の電極と前記第2の電極を含む領域を、銅箔 で形成し、この上にNIが接環された後、前記銅器と前 記Niをパターニングすることで解決するものである。 【0013】Niは、Auと異なり、導体の銅狢と同時 にFeC!3. CuC!2等のエッチャントによりエッ チングが可能であり、図6のように全面に銅箔が付けら れ、そこにメッキすれば、電流を流すための引き出し線 が全く不要となる。

#### [0014]

【発明の実施の形態】以下に本発明の実施形態に係る復 成集積回路装置を説明する。図1、図2は、フレキシブ ルシートの貼り合わせ状態が異なるだけであり、それ以 外は、実質同じである。また従来例として説明した図7 50 更には、フレキシブルシート10上のバッド20と非重

の符号を採用して説明してゆく。

【①①15】まず少なくとも衰面が絶縁処理され、この 上にCuのパターンが彼着された混成集論回路基板11 がある。この混成集論回路基板 1 1 は、セラミック、金 周、プリント基板等が色々と考えられる。セラミックや プリント基板のように絶縁材料で成る墓板では、特に必 夢としないが、ここでは金麗基板を採用しているため、 表面に絶縁制脂12が彼着されている。 夏に配線17、 18...パッド20、21やランド14等のCuパターン

【()()16】まず金属基板全面に銅箔が貼り合わされ、 この銅箔がレジストを介してエッチングされ、所定のパ ターンに形成されている。ここでCuパターンは後述す るフレキシブルシート10の下層、またフレキシブルシ ート10との非重量部下1、下2に形成される。特にフ レキシブルシート10の下層には、配線や印刷抵抗等の 厚みの薄いものが配置されるものとして適当である。ま たチップ抵抗。チップ!C等がフレキシブルシート10 の下に形成される場合は、後述する接着剤28の厚みを 20 調整する必要がある。また金属細線がボンディングされ るパット20の下には、配線ぐらいで厚みのあるチップ 抵抗等の素子を配置することは好ましくない。

【①①17】この基板上には、回路を構成させていた が、回路を構成せず支持基板として活用しても良い。即 ち、後述のフレキシブルシートで回路を実現し、この文 特基板はボンディング時の構造板として活用しても良 い。この場合、ICチップは、図の如くランド14上に 載置されても良い。またランドを省略して直接載置して も良い。この場合、熱抵抗が考慮されて、絶縁樹脂12 ものである。第3に、金属細線の接続部に対応する第2 30 は、省略される。またフレキシブルシート14上に形成 したランドに載置しても良い。

> 【①①18】続いて、フレキシブルシート10がある。 このフレキシブルシートは、ポリイミドフィルムまたは ボリエチレンテレフタレート等が好ましい。この上に は、前述した混成集論回路基板と同様にCuパターン電 極が接着されている。ことのパターンは、パッド16、 20. アイランド24、配線17、22、23等であ

【0019】そしてフレキシブルシート10には、 [C 46 チップ13用の開口部30が設けられている。特に関口 部30が設けられる理由として、10の発熱がある。フ レキシブルシートは、熱圧導性が悪いので、直接金属基 板を露出させ、とこのランド14に固着することで、! Cの放熱を良好にしている。ここで発熱が少ないIC は、開口部を設けず、フレキシブルシート10上のラン ドに直接固着しても良い。

【0020】とのパターンが形成されたフレキシブルシ ート10は、接着剤28を介して固着されるが、ここで はアクリル系またはエポキシ系の接着剤が用いられる。

昼部に位置するバッド21. | C チップと電気的に接続されるパッド16、その他のパッド(アイランド)24は、金属細線により接続される。

【0021】本発明の特徴は、熱圧着を採用しないもの。即ちA!の細線によるボンディングを採用することにある。つまりA!のボンデイングは、窒温で超音波ボンディングを採用するため、フレキシブルシート10や接着剤28を軟らかくすることが無く、ボンダビリティを向上させることができる。

【0022】特にポリイミド系のフレキシブルシートの 10 れる。 Tg(ガラス転移温度)は、200度、ポリエチレンテ 【00 レフタレートのフレキシブルシートのTgは、80度程 ート) 度、またアクリル系の接着剤のTgは、30~40度、 でフレ エポキシ系の接着剤のTgは、80~150度程度であ 7.2 る。従ってこの温度から判るように、フレキシブルシー トも接着剤も硬い状態であり、ボンダビィリティは低下 しない。

【0023】またA!細線は、Au. N!の両者に接続が可能である。しかしフレキシブルシートの柔らかさ、100μm以下のファインパターンでは、Auは電解メー20ッキが好ましい点、更には電解メッキでは、電解メッキする部分に電流を流すための引き回し線が必要となる点の3点が考慮され、フレキシブルシート10上のボンディングエリアには、Cuパターンの上にN!がメッキされている。

【1) () 2.4】 Niは、硬質であり、A 1 細線との接続が 可能で、以下述べる製造方法(図6)で判るように、N 」は選択エッチングが可能であること、しかも全面に銅 箔を貼り合わせてから、比較的広いエリアを電解でN! メッキでき、ファインパターンにエッチングできる等の 30 特徴を有する。 図8は 開口部30の中の接続形態を 3種類説明するための図面であり、第1は、フレキシブ ルシート上のパッド16とIC上のパッド31を接続す るもの。第2は、フレキシブルシート下の配線から延在 されたパッド33と1C上のパッド32を接続するも の。第3として、フレキシブルシート下の配線から延在 されたパッド34とフレキシブルシート上の配線から延 在されたパッド35とを接続するものである。この3つ の形態は、一つの関口部に対して、1つが選ばれて成る もの、2つを選んで成るもの、全てが実施されるものが 40 考えられ、第3の接続方法では、「Cチップ」3 ラン ド14が省略されても良い。

【0025】どちちにしても、ボンディング時に加熱されないので、バッド33・・・、バッド34・・・は、硬さを維持するのでボンダビリティの向上が実現できる。NI電解メッキによるボンダビィリティの優れた点は、NIの純度が高い亭、ボンディング前のチップコンデンサ、チップ抵抗の半田付けによる熱処理、ICチップのダイボンド時の熱処理により、緻密な酸化膜が形成され、その後は軽化時が低点しない。従ってボンディン

グ時、容易に酸化膜が破れポンディングが可能となる。 【0026】先ず図3に示すように、絶縁材料12で絶縁処理された混成集積回路基板11にCuパターン! 4.18、20等を形成する。ここでは他にも形成されるが省略されている。続いて、図4のように一点鎖銀の矩形領域40を超出したレジスト膜41を被疑し、ここに電解メッキを行う。ここでパッド20には配線18により電流を流すために電圧が印加されるようになっており、点でハッチングしたように、Ni被膜42が形成される

【0027】更には、図5に示すようにフレキシブルシート10を接着剤28を介して貼り合わせている。ここでフレキシブルシート10には、Cuパターン16、17、20、22等が形成されている。また復成最積回路基板11のランド14が露出されるように関口部30が形成されている。そして図4に示す方法を利用して、Niメッキの部分を露出したレジストを介してNiがメッキされる。

【0028】最後に接着剤28を介して貼り合わされ、接着剤を硬化してからA1の細線がボンディングされる。ここで図4の複成集積回路基板11上へのNiメッキは、図6のように処理されても良い。図6は、まず複成集積回路基板11全面に網路43が貼り合わされ、Niメッキが施される部分、つまりここではパッド20・・を含む領域に電解メッキを行う。ここでは全面にCuが貼り合わされているので、パターン間に電流を流すための引き回し線は全くいらない。フレキシブルの場合も、環成集積回路基板11をフレキシブルシート10に置き換えれば同様にできる。そしてこのNiが形成された領域44、網番43をレジストを介してエッチングすることによりNiが被着されたパターンが形成できる。

【0029】そして最後に混成集績回路基板の上に蓋をかぶせるような形状の手段。一般にはケース材と呼ばれているものを採用して封止している。この構造は、中空構造やこの中に別途樹脂が注入されているものである。また、半導体ICのモールド方法として有名なトランスファーモールド。ICチップ12や金属細線の部分に樹脂を塗布するボッティング法等で對止されている。

[0030]

【発明の効果】以上説明したように、第1に、金属細線の接続部に対応する提成集積回路基板側の第1の電極もよびフレキシブルシート側の第2の電極に、Niを被疑し、この被覆されたNiとAlより成る前記金属細線とをワイヤボンディングで接続することで、Alのワイヤボンデイングが室温で可能となるため、フレキンブルシート自身、フレキシブルシート下の接着剤の軟化が防止でき、ボンダビィリティの向上が実現できる。しかもAl細線によりコストの低減も実現できる。

され、その後は酸化膜が成長しない。従ってボンディン 50 【0031】更には、フレキシブルシート上で前記第2

(5)

特闘平11-126952

の電極の近傍のCuの第3の電極と前記第2の電極を含む領域を、銅箔で形成し、この上にNiが被覆された後、前記銅箔と前記Niをパターニングすることで、Niの接着されるCuパターンに電流を流すための引き回し線が不要となり、この引き回し線が無い分、実鉄密度を向上させることができる。

## 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の復成集積回路装置を説明する斜視図である。

【図2】本発明の他の復成集補回路鉄置を説明する斜視 10 図である。

【図3】本発明の復成集積回路装置の製造方法を説明する図である。

【図4】本発明の復成集積回路装置の製造方法を説明する図である。

【図5】本発明の提成集積回路装置の製造方法を説明する図である。

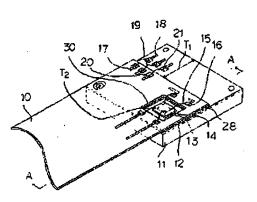
\*【図6】本発明の復成集積回路装置の製造方法を説明する図である。

【図7】従来の提成集補回路装置を説明する図である。 【図8】本発明の側口部の接続形態を説明する図であ

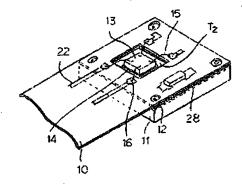
る。 【符号の説明】

10	フレキシブルシート
1 1	絕緣樹脂
1 3	I Cチップ
1 4	ランド
15	A ! 細線
16	パッド
17.18	配線
19	A ! 細線
20.21	パッド
22	配線
30	関口部

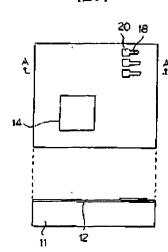
【図1】



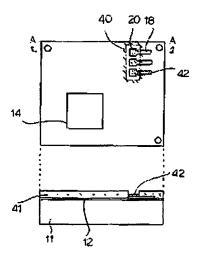
【図2】



【図3】

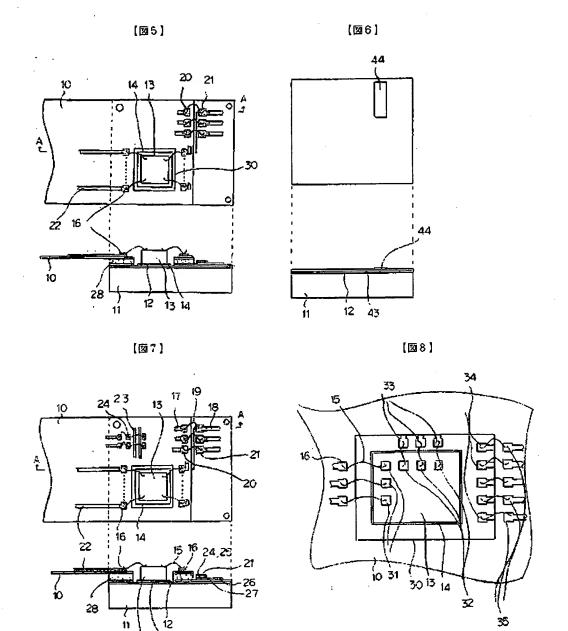


【図4】



特闘平11-126952

(6)



フロントページの続き

(元) 発明者 金沢 克広 大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号 三 洋電機株式会社内

13

(元) 発明者 小林 藏章 大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号 三 洋電機株式会社内

# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

11-126952

(43)Date of publication of application: 11.05.1999

(51)Int.CL

H05K 1/14

H01L 21/60

HO5K 3/36

(21)Application number: 09-289875

(71)Applicant: SANYO ELECTRIC CO LTD

(22)Date of filing: 22.10.1997

(72)Inventor: IGARASHI YUUSUKE

(12)MYCHO

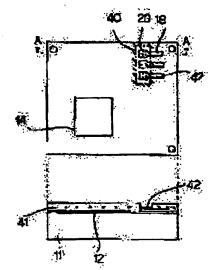
SAKAI NORIHIRO NAKAMURA TAKESHI KANAZAWA KATSUHIRO KOBAYASHI YOSHIYUKI

## (54) HYBRID INTEGRATED CIRCUIT DEVICE AND ITS MANUFACTURE

#### (57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To eliminate the need for heating the circuit board of a hybrid integrat ed circuit by omitting Au thin wires and Au coatings by coating a first electrode on the circuit board side and a second electrode on a flexible sheet side with Ni and connecting metallic wires composed of the coating Ni and Al to each other by wire bonding.

SOLUTION: Cu patterns 14, 18, and 20 are formed on the circuit board 11 of a hybrid integrated circuit insulated with an insulating material 12. Then the surface of the circuit board 11 is coated with a resist film 41 having a rectangular window 40 and electroplating is performed. After electroplating, Ni coatings 42 are formed on pads 20 by impressing voltages upon wires 18 so as to make electric currents flow. In addition, a flexible sheet is stuck to the board 11 with an adhesive. Finally, Al thin wires are bonded after the adhesive is cured. Therefore, the wire bonding of the Al thin wires becomes possible at a room temperature and the



bondability of the thin wires can be improved, because the flexible sheet itself can prevent the softening of the underlying adhesive.

#### LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]
[Date of registration]
[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

## JP,11-126952,A

#### \* NOTICES \*

Japan Patent Office is not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.\*\*\*\* shows the word which can not be translated.
- 3. In the drawings, any words are not translated.

## **CLAIMS**

## [Claim(s)]

[Claim 1] The hybrid integrated circuit substrate with which the electric conduction pattern was prepared in the front face by which insulating processing was carried out at least, The flexible sheet which an electric conduction pattern is prepared in a front face, and was stuck on said hybrid integrated circuit substrate through adhesives, The 1st electrode of Cu prepared in said hybrid integrated circuit substrate corresponding to the non-superimposing section with said flexible sheet, In the hybrid integrated circuit equipment which has the metal thin line which connects electrically said the 2nd electrode and electrode and said 2nd electrode of Cu prepared in said flexible sheet [1st] Hybrid integrated circuit equipment characterized by connecting to said the 1st electrode and 2nd electrode corresponding to a connection of said metal thin line said metal thin line which nickel is covered and consists of this nickel and aluminum that were covered by wirebonding.

[Claim 2] Hybrid integrated circuit equipment according to claim 1 with which Au is covered by the front face of said 1st electrode corresponding to the connection of said metal thin line.

[Claim 3] A substrate and the flexible sheet which an electric conduction pattern is prepared in a front face, and was stuck on said hybrid integrated circuit substrate through adhesives, The 1st electrode of the semiconductor chip prepared in said substrate corresponding to said flexible sheet top or opening of said flexible sheet, In the hybrid integrated circuit equipment which has the metal thin line which connects electrically said the 2nd electrode and electrode and said 2nd electrode of Cu prepared in said flexible sheet [1st] Hybrid integrated circuit equipment characterized by connecting to the 2nd electrode corresponding to the connection of said metal thin line said metal thin line which nickel is covered and consists of this nickel and aluminum that were covered by wirebonding.

[Claim 4] An electric conduction pattern is prepared in the front face of the hybrid integrated circuit substrate by which insulating processing was carried out at least. The 1st electrode of Cu prepared in said hybrid integrated circuit substrate through adhesives at said hybrid integrated circuit substrate corresponding to lamination and the non-superimposing section with said flexible sheet in the flexible sheet with which the electric conduction pattern was prepared in the front face, In the manufacture approach of the hybrid integrated circuit equipment which connects the 2nd electrode of Cu prepared in said flexible sheet with a metal thin line on said flexible sheet near said 2nd electrode The

field which the 3rd electrode of Cu is prepared and contains said the 2nd electrode and said 3rd electrode is the manufacture approach of the hybrid integrated circuit equipment characterized by carrying out patterning of said copper foil and said nickel after being formed by copper foil and covering nickel on this.

#### \* NOTICES \*

Japan Patent Office is not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.\*\*\*\* shows the word which can not be translated.
- 3. In the drawings, any words are not translated.

## DETAILED DESCRIPTION

# [Detailed Description of the Invention]

[0001]

[Field of the Invention] About hybrid integrated circuit equipment, insulating processing of the front face is carried out at least, and this invention relates to the equipment which stuck the flexible sheet on this, using a substrate as the hybrid integrated circuit substrate with which wiring and a component were mounted, or a mere support substrate.

[0002]

[Description of the Prior Art] Generally, the degree of integration of hybrid integrated circuit equipment is taken into consideration, and there is hybrid integrated circuit equipment with which multilayer structure was adopted. This is explained to JP,04-273151,A, JP,04-87358,A, etc. in detail.

[0003] Especially the latter official report is what stuck the flexible sheet on aluminum substrate of anodizing with which Cu pattern was formed, and is stuck on some substrates. On the other hand, wearing nature with a device was taken into consideration, the flexible sheet 10 was adopted, and, as for <u>drawing 7</u>, the sectional view corresponding to [corresponding to a top view in a top] an A-A line in the bottom is explained by one in drawing.

[0004] At least, a front face is the hybrid integrated circuit substrate by which insulating processing was carried out, since the metal substrate is adopted here, insulating resin 12 is put on a front face, and, as for the drawing number 11, Cu pattern is formed on this. This Cu pattern changes in the island 24 grade formed in order to avoid the crossover with the pads 20 and 21 for connecting the wiring 17 of the land 14 in which the IC chip 13 is carried, the bonding pad 16 to which IC chip is connected through the metal thin line 15, and the flexible sheet 10, and the wiring 18 of the hybrid integrated circuit substrate 11 through the metal thin line 19, and wiring 22 and wiring 23 which extend to a device.

[0005] And a means of a configuration by which a lid is put on a hybrid integrated circuit substrate, and the thing currently generally called case material are adopted and closed. As for this structure, resin is separately poured in hollow structure and in this. Moreover, the closure is carried out by the potting method which applies resin to the parts of a transfer mold famous as the mold approach of a semiconductor IC, and an IC chip 12 metallurgy group thin line.

[0006]

[Problem(s) to be Solved by the Invention] An ambient atmosphere-proof is taken into consideration and, as for pads 16, 20, and 21 and island 24 grade, Au plating 25 is performed here. However, since the layer of the bottom of a pad becomes by Cu26,

nickel plating 27 hard as a substrate is performed from the softness. However, there were the following problems.

[0007] \*\* The Au plating 25 is very expensive as an ingredient, and causes the rise of cost.

- \*\* The nickel plating 27 is required as a substrate.
- \*\* The etchant of Au is an aqua regia, and even if it is going to carry out patterning after complete plating, selective etching is impossible and can cover it only with electrolytic plating or electroless deposition on the pad by which patterning was carried out. [0008] In the former electrolytic plating, the leading-about line for passing a current is needed for pads 16, 20, and 21 and an island 24, and it becomes the hindrance of packaging density. In the latter electroless deposition, if pads 16, 20, and 21, an island 24, and spacing of wiring become a fine pattern 100 micrometers or less, it will become a short cause. For example, Au will generate and connect too hastily between pads 21 and 21 and 21.

[0009] Moreover, when it was going to form the bonding post on the pattern only by nonelectrolyzed nickel plating, Lynn etc. is mixed in the non-electrolyte as an impurity, and when this impurity deposited, there was a problem on which bonder BIIRITI gets worse. \*\* When wire bonding is carried out using the thin line of Au, since approaches are a supersonic wave and thermocompression bonding junction, also at the lowest, substrate temperature is needed about 150 to 170 degrees. The flexible sheet 10 and the lower layer adhesives 28 become soft for this temperature, and a bonder kinky thread tee gets worse. The more it becomes especially a fine pattern and many numbers of bondings become, the more this problem becomes remarkable.

[Means for Solving the Problem] This invention was accomplished in view of the above-mentioned technical problem, covers nickel the 1st to the 1st electrode by the side of the hybrid integrated circuit substrate corresponding to the connection of a metal thin line, and the 2nd electrode by the side of a flexible sheet, and solves it by connecting said metal thin line which consists of this nickel and aluminum that were covered by wirebonding.

[0011] It solves by covering Au the 2nd on the front face of said 1st electrode corresponding to the connection of said metal thin line. It solves by connecting to the 2nd electrode corresponding to the connection of a metal thin line said metal thin line which covers nickel and consists of this nickel and aluminum that were covered by wirebonding the 3rd.

[0012] Since bonding of the aluminum wire is carried out by the room temperature and the supersonic wave and it can carry out bonding of the nickel, it can omit Au thin line and Au coat, and does not need to heat a substrate. After forming the field which contains said the 2nd electrode and said 3rd electrode [2nd] of Cu near the electrode in the 4th on a flexible sheet by copper foil and covering nickel on this, said copper foil and said nickel are solved by carrying out patterning.

[0013] nickel will become completely unnecessary [ the outgoing line for passing a current ], if unlike Au it can etch into the copper foil and coincidence of a conductor by the etchant of FeCl3 and CuCl2 grade, copper foil is attached to the whole surface like drawing 6 and it plates there.

[0014]

[Embodiment of the Invention] The hybrid integrated circuit equipment concerning the operation gestalt of this invention is explained below. as for <u>drawing 1</u> and <u>drawing 2</u>, the lamination conditions of a flexible sheet only differ -- it is -- except [ its ] -- parenchyma -- it is the same. Moreover, the sign of <u>drawing 7</u> explained as a conventional example is adopted and explained.

[0015] Insulating processing of the front face is carried out at least first, and there is a hybrid integrated circuit substrate 11 with which the pattern of Cu was put on this. This hybrid integrated circuit substrate 11 is considered [ that a ceramic, a metal, a printed circuit board, etc. are various and ]. Especially in the substrate which changes by the insulating material like a ceramic or a printed circuit board, although not needed, since the metal substrate is adopted here, insulating resin 12 is put on the front face. Furthermore, wiring 17 and 18, pads 20 and 21, and Cu pattern electrode of land 14 grade are formed.

[0016] Copper foil is first stuck all over a metal substrate, and this copper foil is etched through a resist and formed in the predetermined pattern. Cu pattern is formed in the lower layer of the flexible sheet 10 mentioned later, and the non-superimposing sections T1 and T2 with the flexible sheet 10 here. It is especially suitable for the lower layer of the flexible sheet 10 as that by which what has thin thickness, such as wiring and printing resistance, is arranged. Moreover, when a chip resistor, Chip IC, etc. are formed in the bottom of the flexible sheet 10, it is necessary to adjust the thickness of the adhesives 28 mentioned later. Moreover, it is not desirable that a metal thin line arranges components, such as a chip resistor which is thick with wiring, under the pad 20 by which bonding is carried out.

[0017] On this substrate, although the circuit was made to constitute, a circuit may not be constituted but you may utilize as a support substrate. That is, the below-mentioned flexible sheet may realize a circuit and this support substrate may be utilized as the back up plate at the time of bonding. In this case, IC chip may be laid on a land 14, as shown in drawing. Moreover, a land may be omitted and you may lay directly. In this case, thermal resistance is taken into consideration and insulating resin 12 is omitted. Moreover, you may lay in the land formed on the flexible sheet 14.

[0018] Then, there is a flexible sheet 10. This flexible sheet has a polyimide film or desirable polyethylene terephthalate. Besides, Cu pattern electrode is put like the hybrid integrated circuit substrate mentioned above. The patterns here are pads 16 and 20, an island 24, wiring 17 and 22, and 23 grades.

[0019] And the opening 30 for IC chip 13 is formed in the flexible sheet 10. Generation of heat of IC is one of reasons especially the opening 30 is formed. Since thermal conductivity is bad, a flexible sheet exposes a direct metal substrate, is fixing to the land 14 here, and makes heat dissipation of IC good. IC with little generation of heat may not prepare opening, but may fix directly to the land on the flexible sheet 10 here.

[0020] Although the flexible sheet 10 with which this pattern was formed fixes through adhesives 28, the adhesives of acrylic or an epoxy system are used here. Furthermore, the pad 21 located in the pad 20 on the flexible sheet 10 and the non-superimposing section, the pad 16 electrically connected with IC chip, and the other pads (island) 24 are connected by the metal thin line.

[0021] The description of this invention is to adopt what does not adopt thermocompression bonding, i.e., the bonding by the thin line of aluminum. That is, since

an ultrasonic bonding is used for the bonding of aluminum at a room temperature, it can make soft neither the flexible sheet 10 nor adhesives 28, and can raise a bonder kinky thread tee.

[0022] For Tg (glass transition temperature) of the flexible sheet of a polyimide system, Tg of the flexible sheet of polyethylene terephthalate is [especially Tg of the adhesives of an epoxy system of Tg of about 80 degrees and acrylic adhesives] about 80 - 150 degrees 30 to 40 degrees 200 degrees. Therefore, a flexible sheet and adhesives are in a hard condition, and bonder BIIRITI does not fall so that this temperature may show. [0023] Moreover, aluminum thin line is connectable with both Au and nickel. However, three of the points that a leading-about line for Au to pass a current further into the point that electrolytic plating is desirable, and the part which carries out electrolytic plating in electrolytic plating is needed are taken into consideration, and nickel is plated with the softness of a flexible sheet, and a fine pattern 100 micrometers or less on Cu pattern by the bonding area on the flexible sheet 10.

[0024] It has the description of that nickel is hard, connection with aluminum thin line is possible for it, and selective etching is possible for nickel so that it may understand by the manufacture approach (<a href="mailto:drawing6">drawing6</a>) described below, nickel plating of the comparatively large area being carried out in electrolysis, and being able to etch into a fine pattern, since copper foil is moreover stuck on the whole surface. Drawing 8 is a drawing for explaining three kinds of topologies in opening 30, and the 1st connects the pad 16 on a flexible sheet, and the pad 31 on IC. The 2nd connects the pad 33 which extended from wiring under a flexible sheet, and the pad 32 on IC. As the 3rd, the pad 34 which extended from wiring under a flexible sheet, and the pad 35 which extended from wiring on a flexible sheet are connected. These three gestalten can consider that by which what one is chosen and changes, and all the things that choose two and change are carried out to one opening, and the IC chip 13 and a land 14 may be omitted in the 3rd connection method.

[0025] since it is not heated at the time of bonding whichever it makes it -- a pad 33 ... and a pad 34 -- since ... maintains hardness, improvement in a bonder kinky thread tee is realizable. A precise oxide film is formed of heat treatment by the chip capacitor before that the point which was excellent in bonder BIIRITI by nickel electrolytic plating has the high purity of nickel, and bonding, and soldering of a chip resistor, and heat treatment at the time of the die bond of IC chip, and an oxide film does not grow after that. Therefore, at the time of bonding, an oxide film is torn easily and bonding becomes possible. [0026] As first shown in drawing 3, the Cu patterns 14 and 18 and 20 grades are formed in the hybrid integrated circuit substrate 11 by which insulating processing was carried out by the insulating material 12. It is omitted although formed in others here. Then, the resist film 41 which exposed the rectangle field 40 of an alternate long and short dash line like drawing 4 is covered, and electrolytic plating is performed here. In order to pass a current with wiring 18 to a pad 20 here, as an electrical potential difference is impressed and hatching was carried out at the point, the nickel coat 42 is formed. [0027] Furthermore, as shown in drawing 5, the flexible sheet 10 is stuck through adhesives 28. The Cu patterns 16, 17, and 20 and 22 grades are formed in the flexible sheet 10 here. Moreover, opening 30 is formed so that the land 14 of the hybrid integrated circuit substrate 11 may be exposed. And nickel is plated through the resist which exposed the part of nickel plating using the approach shown in drawing 4.

[0028] After being stuck through adhesives 28 finally and hardening adhesives, bonding of the thin line of aluminum is carried out. nickel plating of a up to [ the hybrid integrated circuit substrate 11 of <a href="mailto:drawing 4">drawing 4</a>] and nickel plating of a up to [ the flexible sheet 10 ] may be processed like <a href="mailto:drawing 6">drawing 6</a> here, the part to which, as for <a href="mailto:drawing 6">drawing 6</a>, copper foil 43 is first stuck all over hybrid integrated circuit substrate 11, and nickel plating is performed, i.e., here, -- a pad 20 -- electrolytic plating is performed to the field containing. Here, since Cu is stuck on the whole surface, the leading-about line for passing a current between patterns is not needed at all. When flexible, if the hybrid integrated circuit substrate 11 is transposed to the flexible sheet 10, it can do similarly. And the field 44 in which this nickel was formed, and the pattern on which nickel was put by etching copper foil 43 through a resist can be formed.

[0029] And a means of a configuration by which a lid is finally put on a hybrid integrated circuit substrate, and the thing currently generally called case material are adopted and closed. As for this structure, resin is separately poured in hollow structure and in this. Moreover, the closure is carried out by the potting method which applies resin to the parts of a transfer mold famous as the mold approach of a semiconductor IC, and an IC chip 12 metallurgy group thin line.

[0030]

[Effect of the Invention] As explained above, the 1st to the 1st electrode by the side of the hybrid integrated circuit substrate corresponding to the connection of a metal thin line, and the 2nd electrode by the side of a flexible sheet By connecting said metal thin line which covers nickel and consists of this nickel and aluminum that were covered by wirebonding Since wirebonding of aluminum becomes possible at a room temperature, softening of the adhesives under the flexible sheet itself and a flexible sheet can be prevented, and improvement in bonder BIIRITI can be realized. And reduction of cost is also realizable with aluminum thin line.

[0031] Furthermore, after forming the field which contains said the 2nd electrode and said 3rd electrode [2nd] of Cu near the electrode on a flexible sheet by copper foil and covering nickel on this, by carrying out patterning of said copper foil and said nickel, the leading-about line for passing a current to Cu pattern on which nickel is put can become unnecessary, and a part and packaging density without this leading-about line can be raised.